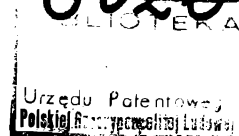


15 października 1927 r.

2

URZĄD PATENTOWY



RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

OPIŚ PATENTOWY

Nr 6238.

Kl. 42 h 14.

Jan Krukowski
(Warszawa, Polska).

Statyw mikroskopowy.

Zgłoszono 3 marca 1925 r.
Udzielono 5 listopada 1926 r.

Statyw mikroskopu projekcyjnego według wynalazku przedstawiony jest na załączonym rysunku, a mianowicie: na fig. 1 — przekrój wzdłuż osi *CD* figury 2; na fig. 2 — widok z przodu i na fig. 3 — przekrój według *AB* figury 2. Identyczna zasada może być stosowana i do mikroskopów do obserwacji subiektywnej. *E* oznacza stolik mikroskopu, *F* — deseczkę metalową, na której zamontowana jest gільza z wysuniętą w nią rurką z obiektywem (ewentualnie i okularum) projekcyjnym. Otwór *I* służy dla prowadnicy. *G* oznacza rurkę z systemem optycznym projekcyjnym. Obok niej mieści się mechanizm śruby mikrometrycznej. Rurka *K* jest na stałe przymocowana do stolika *E*, rurka *L* do *F*. Rurki te są do siebie ściśle przyszlifowane. Rurka *L* jest zamknięta przykrywką *O*, w rurce *K* znajduje

się przegrodka *M* z nagwintowanym otworem; przy wkręcaniu zapomocą moletowanej główki *H* właściwej śruby mikrometrycznej *L* w tuleję *M* naciska ona pokrywę *O* i zbliża części *F* i *E* do siebie. Przy odkręcaniu rozsuwa je sprężyna *N*. *R* jest urządzeniem do przymocowywania mikroskopu do latarni projekcyjnej.

Fig. 3 przedstawia widok śruby mikrometrycznej (*K*, *L*, *H*) oraz przekrój przez prowadnicę *P*. Prowadnica ta składa się z cylindrycznego pręta, wchodzącego w otwór *I* części *F* i zapewniającego stałość położenia tej części.

Wskutek znacznego oddalenia prowadnicy od osi śruby mikrometrycznej, ewentualnie niedokładności powłokowej, t. j. prowadnicy, mniej się zaznacza podczas funkcjonowania, niż przy syste-

mach, w których powierzchnie kierunkowe są przy samej śrubie mikrometrycznej. Wszystkie części mogą być wykonane na tokarni, a więc łatwo osiągnąć precyzyjność.

Zastrzeżenie patentowe.

Statyw mikroskopowy z śrubą mikrome-

tryczną i oddzielną prowadnicą, znamienny tem, że prostopadłość przesuwania jednej części statywu względem drugiej jest uwarunkowana oddzielną od mechanizmu przesuwającego, t. j. śruby mikrometrycznej, prowadnicą.

J. K r u k o w s k i.

